

El Instituto Nacional de Normalización, INN, certifica que:

**DESARROLLO DE TECNOLOGIAS Y SISTEMAS LTDA.,
DTS LTDA.**

ubicado en Av. Rodrigo de Araya N°1263, Macul, Santiago

ha renovado su acreditación en el Sistema Nacional de Acreditación del INN, como

**Laboratorio de calibración
según NCh-ISO/IEC 17025:2017**

en la Magnitud Longitud, con el alcance indicado en anexo.

Primera acreditación: Desde el 28 de enero de 2000

Vigencia de la Acreditación: hasta el 28 de junio de 2021

Santiago de Chile, 18 de agosto de 2020

Este Certificado tiene firma electrónica. Ver última página de este documento.
Para una adecuada visualización del documento en formato PDF o para su
impresión, se recomienda abrirlo utilizando un navegador.

Eduardo Ceballos Osorio
Jefe de División Acreditación

Sergio Toro Galleguillos
Director Ejecutivo



ACREDITACION LC 017

ALCANCE DE LA ACREDITACION DE DESARROLLO DE SISTEMAS Y TECNOLOGIAS LTDA., DTS LTDA., COMO LABORATORIO DE CALIBRACION

AREA : LONGITUD

Servicio de calibración			Rango del mensurando			Capacidad de medición y calibración (CMC)			Patrón de referencia usado en la calibración	
Instrumento o sistema de medición	Método y Norma/Documento de base	Condición de la medición	Mín (mayor que)	Máx. (menor o igual que)	Unidades	Valor	Unidades	Nivel de confianza	Patrón	Fuente de trazabilidad inmediata
Pie de metro Análogo Res. 0,01 mm	6752PRO024-1 ISO 3599-1976 Comparación	(21 ± 2) °C (50 ± 15) %HR	0	1050	mm	8,4+(35*L/1000)	µm	95%	Set Bloques Patrones	LCPN-L DICTUC
Pie de metro Análogo Res. 0,02 mm			0	1050	mm	19,4+(30*L/1000)	µm	95%		
Pie de metro Análogo Res. 0,05 mm			0	1050	mm	55,5+(17*L/1000)	µm	95%		
Pie de metro Digital Res. 0,01 mm	6752PRO024-1 ISO 3599-1976 Comparación	(21 ± 2) °C (50 ± 15) %HR	0	1050	mm	2,3+(40*L/1000)	µm	95%	Set Bloques Patrones	LCPN-L DICTUC
Pie de metro Digital Res. 0,02mm			0	1050	mm	7,6+(36*L/1000)	µm	95%		
Pie de metro Digital Res. 0,05mm			0	1050	mm	5,8+(25*L/1000)	µm	95%		
Micrómetro Exterior Análogo Res. 0,01 mm	6752PRO021-1 Nch2518.Of2000 JISB7502-1994 Comparación	(21 ± 2) °C (50 ± 15) %HR	0	1050	mm	5,8+(8,9*L/1000)	µm	95%	Set Bloques Patrones	LCPN-L DICTUC
Micrómetro Exterior Análogo Res. 0,001 mm			0	300	mm	0,98+(10,6*L/1000)	µm	95%		
Micrómetro Exterior Digital Res. 0,001 mm			0	300	mm	0,44+(12,2*L/1000)	µm	95%		
Micrómetro Interior Análogo Res. 0,01 mm			2	1050	mm	6,7+(15*L/1000)	µm	95%		
Micrometro Profundidad Análogo Res, 0,001 mm			0	300	mm	1,1+(4,5*L/1000)	µm	95%		
Micrometro Profundidad Análogo Res, 0,01 mm			0	1050	mm	5,5+(10*L/1000)	µm	95%		
Comparadores Análogos Res. 0,01 mm	6752PRO023-1	(21 ± 2) °C (50 ± 15)	0	25	mm	2,97	µm	95%	Banco de calibración	DICTUC

Servicio de calibración			Rango del mensurando			Capacidad de medición y calibración (CMC)			Patrón de referencia usado en la calibración	
Instrumento o sistema de medición	Método y Norma/Documento de base	Condición de la medición	Mín (mayor que)	Máx. (menor o igual que)	Unidades	Valor	Unidades	Nivel de confianza	Patrón	Fuente de trazabilidad inmediata
Comparadores Digitales Res. 0,01 mm	33k6-4-889-1 ISO/R463-2006 Comparación	%HR	0	25	mm	2,97	µm	95%	para comparadores	

RESERVADO CABECERA FIRMA DIGITAL

RESERVADO PARA FIRMA ELECTRONICA - SIGN

RESERVADO PARA FIRMA ELECTRONICA - SIGN